

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Име, средње слово, презиме		Снежана М. Ђорић-Вељковић	
Звање		Ванредни професор	
Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када		Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, од 01.09.2000. године	
Ужа научна односно уметничка област		Примењена физика	
Академска каријера			
	Година	Институција	Област
Избор у звање	2011.	Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет	Физичке науке
Докторат	2006.	Универзитет у Нишу, Електронски факултет	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Магистратура	1994.	Универзитет у Нишу, Електронски факултет	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Диплома	1988.	Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, студијска група за физику	Физичке науке
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа			
	Назив предмета	Назив студијског програма, врста студија	Часова активне наставе
1.	Грађевинска физика	ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО	0,6
2.	Термотехничке и електричне инсталације	ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО	1
3.	Инсталације у зградама	ИАС АРХИТЕКТУРА	0,2667
4.	Физика зграда	ИАС АРХИТЕКТУРА	0,2667
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)			
1.	D. Danković, I. Manić, A. Prijjić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, Z. Prijjić, and N. Stojadinović, "Effects of static and pulsed negative bias temperature stressing on lifetime in p-channel power VDMOSFETs", <i>Informacije Midem-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials</i> , vol. 43, iss. 1, pp. 58-66 (2013)		
2.	S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing of Radiation-Induced Defects in Burn-in Stressed Power VDMOSFETs", <i>Nuclear Technology & Radiation Protection</i> , vol. 26, no. 1, pp. 18-24 (2011)		
3.	I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Effects of Low Gate Bias Annealing in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 49, pp. 1003 - 1007 (2009)		
4.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instability in n-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 48, pp. 1313 - 1317 (2008)		
5.	I. Manić, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović and N. Stojadinović, "Mechanisms of Spontaneous Recovery in DC Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs", <i>IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems</i> , vol. 155, pp. 281-288 (2008)		
6.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instabilities in Sequentially Stressed and Annealed in p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 47, pp. 1400 - 1407 (2007)		
7.	С. Голубовић, С. Ђорић-Вељковић, И. Манић, В. Давидовић, "Ефекти напрезања оксида гејта VDMOS транзистора снаге", <i>Монографија</i> , Електронски факултет Ниш, 2006.		
8.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Electrical Stressing Effects in Commercial Power VDMOSFETs", <i>IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems</i> , vol. 153, pp. 281-288 (2006)		
9.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 45, pp. 115-122 – invited paper (2005)		
10.	S. Djorić-Veljković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, "Effects of Burn-in Stressing on Post-Irradiation Annealing Response of Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 43, pp. 1455-1460 (2003)		
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника			
Укупан број цитата		52	
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе		23	
Тренутно учешће на пројектима		Домаћи 1	Међународни
Усавршавања			
Други подаци које сматрате релевантним - Од 2009. до 2012. год. - члан радне групе за организовање заједничких докторских студија (Preparation group for joint doctoral studies) које би организовали грађевински факултети из Београда, Ниша и Скопља заједно са Ruhr University Bochum из Немачке у оквиру SEEFORM - DAAD пројекта - Од 1996. год члан међународног удружења IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers - 2004. године друга награда Министарства за науку и заштиту животне средине за постигнуте резултате у науци - Учесће у реализацији пет домаћих и два међународна пројекта - У току 2003. год. и 2004. год. члан тима међународног пројекта Енергетска ефикасност зграда у југоисточној Европи, са циљем едукације архитеката и инжењера, на којем су учествовали: Архитектонски факултет у Скопљу, Техничка висока школа из Берлина и Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, а под покровитељством DAAD-а (Немачка) и Пакт-а за стабилност југоисточне Европе.			

